

Аннотация дисциплины

| | |
|---|---|
| Наименование дисциплины | Дифракционные и микроскопические методы анализа материалов |
| Формируемые компетенции (части компетенций) | ПК-2 |
| Задачи дисциплины | - развитие теоретических и практических навыков по организации и проведению спектрального и рентгено-флуоресцентного анализа; - развитие теоретических и практических навыков по организации и проведению электронной микроскопии; - изучение отечественного и зарубежного опыта; - изучение особенностей использования специальной литературы по разрабатываемой теме при выполнении выпускной квалификационной работы. |
| Основные разделы / темы дисциплины | 1. Основы спектрального оптико-эмиссионного анализа. 2. Основы спектрального рентгено-флуоресцентного анализа. 3. Основы электронной микроскопии. 4. Основы строения новых перспективных материалов. |
| Форма промежуточной аттестации | «Зачет» «Зачет с оценкой» |

Очная форма обучения

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------------------------|
| Общая трудоемкость дисциплины | 6 зач. ед., 216 акад. час. | | | | | | |
| | Семестр | Аудиторная нагрузка, час. | | | СРС, ч | ИКР, ч | Промеж уточная аттестация, ч |
| | | Лекции | Пр. занятия | Лаб. работы | | | |
| | 3 | 12 | 12 | | 84 | | |
| 4 | 14 | 14 | | 80 | | | |

Очно-заочная форма обучения

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------------------------|
| Общая трудоемкость дисциплины | 6 зач. ед., 216 акад. час. | | | | | | |
| | Семестр | Аудиторная нагрузка, час. | | | СРС, ч | ИКР, ч | Промеж уточная аттестация, ч |
| | | Лекции | Пр. занятия | Лаб. работы | | | |
| | 3 | 12 | 12 | | 84 | | |
| 4 | 14 | 14 | | 80 | | | |